

G01J 赤外線，可視光線または紫外線の強度，速度，スペクトル，偏光，位相またはパルスの測定；色の測定；放射温度測定 [2]

注

(1) このサブクラスは他に分類されない赤外線，可視光線，紫外線の有無の検出を包含する。
(2) クラス G01 のタイトルに続く注に注意すること。

サブクラス内の索引

測光；高温計..... 1/00;5/00
分光測定；測定；偏光；速度；位相；パルス
3/00;4/00;7/00;9/00;11/00

1/00 測光，例．写真の露出計（分光度測定 G01J3/00；放射温度測定に特に適合するもの G01J5/00）

A 検査に係るもの

B ・光センサ

C ・発光ダイオード

D ・光ファイバ

E ・配光

F ・光源；ランプ

G 視感測定に係るもの

H 測定法に係るもの

K 検波型光検出に係るもの

Z その他のもの〔バイオ光センサ含む〕

1/02 ・細部

A 光検出器

B ・半導体光検出器〔赤外線，波長弁別含む〕

C ・赤外線検出器

Y ・焦電型

W ・物体検知用

X ・リモセン用

D ・ストリク管等〔光電子増倍管含む〕

N 光導電型

P 投受型〔物体検知含む〕

Q アレイ型〔イメージセンサ含む〕

R 特殊型〔導波路型，熱電型，液晶，温度・光センサ含む〕

E 露出計

F 積分球

G 紫外線に係るもの〔検出器含む〕

H 赤外線に係るもの〔光学要素含む〕

J 火災・燃焼状態に係るもの

K レザ・光パワに係るもの

L 光ビームに係るもの〔ビーム径含む〕

M 光ファイバを用いるもの

S 照度計〔照度計付機器含む〕

T 輝度計

U 日射計〔太陽センサ含む〕

V 光度計

Z その他のもの〔振動，感電含む〕

1/04 ・光学部分または機械部分

A 光学要素

B ・フィルタ

C ・チヨツパ

D 光学走査・測光機構

E 汚れ防止装置

F 特殊用途

G ・光学読取

H ・欠陥検査

J ・液体分析

K ・気体分析

L ・固体分析

M ・生体分析

Z その他のもの

1/06 ・入射角の限定

A 視野限定

B 光軸調整

C 照準機構

Z その他のもの〔位置調整含む〕

1/08 ・特に測光に適用される光源の構成

1/10 ・参照光，または電気値との比較によるもの

1/12 ・全体的視覚手段によるもの（G01J1/20 が優先）

1/14 ・段階的輝度の表面との比較によるもの

1/16 ・電気的な放射線検出器によるもの（G01J1/20 が優先）

1/18 ・参照電気値との比較によるもの

1/20 ・測定値または参照値の強度が検出器における効果と等しくなるように変えられるもの，例．入射角の変化によるもの

1/22 ・光路中に可変素子を使用するもの，例．フィルタ，偏光手段（G01J1/34 が優先）

1/24 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/26 ・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの

1/28 ・光源の強度または距離の変化によるもの（G01J1/34 が優先）

1/30 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/32 ・測定値または参照値の自動変化に適用されるもの

1/34 ・交互にまたは連続的に使用された分離光路によるもの，例．フリッカ

1/36 ・電気的な放射線検出器によるもの

1/38 ・全体的視覚手段によるもの（G01J1/10 が優先）

1/40 ・可視限界または吸光効果によるもの

1/42 ・電気的な放射線検出器によるもの（参照光または電気値との比較によるもの G01J1/10；光学および機械部分 G01J1/04）

A 紫外線に係るもの

B 赤外線に係るもの〔物体検知，リモセン映像含む〕

C 火災・燃焼状態に係るもの

D レザ・光パワに係るもの

E 光ビームに係るもの〔ビーム径含む〕

F 光ファイバを用いるもの

G ストリク管等を用いるもの〔光電子増倍管含む〕

H アバランシェ・ダイオードを用いるもの

J 照度測定に係るもの〔日射測定を含む〕

K 輝度測定に係るもの

L 光度測定に係るもの

M 閃光測定に係るもの

N 投光・受光測定に係るもの

1/44	P 光学読取等に係るもの	3/30	..スペクトル上で直接スペクトル線強度を測定するもの (G01J3/42,G01J3/44 が優先)
	Q 分析に係るもの		
	R 液晶に係るもの	3/32	...単一検出器によるスペクトルバンドの順次調査
	Z その他のもの〔地震含む〕	3/36	...別々の検出器によるスペクトル中の2以上のバンドの調査
	..電気回路	3/40	..スペクトルの写真濃度の測定によるスペクトル線強度の測定；分光写真 (G01J3/42,G01J3/44 が優先) [4]
	A 測光回路	3/42	..吸収分光測定；二光束分光測定；フリッカ - 分光測定；反射分光測定 (光線切換装置の構成 G01J3/08) [4]
	B 表示回路		U 赤外線吸収分光測定
	C 最小・最大値検出回路		Z その他のもの
	D 温度補償回路	3/427	...二波長分光測定 [4]
	E 感度補償・利得制御回路	3/433	...変調分光測定；微分分光測定 [4]
	F 光電変換回路〔演算増幅器，対数圧縮等〕	3/44	..ラマン分光測定；散乱分光測定 [4]
	G カメラ用測光回路	3/443	..発光分光測定 [4]
	H 露出制御回路〔G03B7/00 参照〕	3/447	..偏光分光測定 [4]
	J 接合容量の影響除去回路	3/45	..干渉分光測定 [4]
	K 情報設定回路	3/453	...振幅の相互干渉によるもの [4]
	L デジタル回路	3/457	..相関分光測定，例．スペクトル強度の相関 (G01J3/453 が優先) [4]
	M 周波数成分検出回路〔チラツキ，等含む〕	3/46	・色の測定；色測定装置，例．比色計 (色温度の測定 G01J5/60) [4]
	N 多素子測光回路		A 比色計
	P 半導体回路〔イメ - ジセンサ・CCD・波長分離含む〕		Z 色測定装置，方法一般
	Z その他のもの	3/50	..電気的な放射線検出器によるもの [4]
1/46	...コンデンサ - によるもの	3/51	...色フィルタ - を用いるもの [4]
1/48	・化学的效果によるもの	3/52	..色標によるもの
1/50	..指示器の色が変化するもの，例．化学光量計	4/00	偏光の測定 [2]
1/52	..写真効果によるもの	4/02	・視野分離形偏光計；半影形偏光計 [2]
1/54	..ガスの光反応を観察することによるもの	4/04	・電気的検出手段を利用する偏光計 (G01J4/02 が優先) [2]
1/56	・放射圧またはラジオメ - タ - の効果によるもの		A 偏光子，補償子および検光子の組合せ，PCSA 方式
1/58	・光により発生したルミネッセンスによるもの		D 直線偏光の方位角を測定するもの，方位偏光計，旋光計
1/60	・目のひとみを測定することによるもの		Z その他のもの
3/00	分光測定；分光光度測定；モノクロメータ；色の測定 [4]	5/00	放射温度計
3/02	・細部		A 検査に係るもの
	C 較正・補正		E ・検査用黒体炉
	R 表示・記録装置の構成		B 放射率測定に係るもの
	S センサ - の構成		Z その他のもの
	Z その他のもの	5/00 101	・測温対象が特殊なもの
3/04	..スリットの構成		B シ - ト状物体の測温
3/06	..走査装置の構成		C 半導体基板の測温
3/08	..光線切換装置の構成		D 溶融物体の測温
3/10	..特に分光測定または比色測定に適用される光源の構成		E 線状、筒状体の測温
3/12	・スペクトルの発生；モノクロメータ		A その他の炉内、金属表面の測温
3/14	..屈折素子，例．プリズム，によるもの (G01J3/18,G01J3/26 が優先)		F 電子レンジ内の測温
3/16	...自動視準装置をもつもの		G 耳式、体腔内式体温計
3/18	..回折素子，例．回折格子，によるもの		Z その他のもの
3/20	...ロ - ランド円分光計	5/02	・細部
3/22	...リトロミラ - 分光計		J 検出器の構造
3/24	...特定次数のために設計された回折格子によるもの		L 測温位置設置用黒体
3/26	..多重反射によるもの，例．ファブリ - ペロ - 干渉計，可変干渉フィルタ -		T 冷却の構造
3/28	・スペクトルの調査 (色フィルタ - を用いるもの G01J3/51) [4]	5/04	Z その他のもの
		5/06	..ケ - ス
		5/08	..妨害放射線の影響を除去するための構成
			..光学的特徴

	A	ファイバ等を用いるもの		Z	その他のもの
	D	回転ミラ - を用いるもの	5/62		.. 光をチョッピングする手段によるもの
	Z	その他のもの		A	光学系・構造的なもの
5/10		・電氣的な放射線検出器によるもの		B	電気回路に係るもの
	B	補償 [5/16,5/48 優先]		Z	その他のもの
	C	温度分布測定 [5/48 優先]	7/00		光速度の測定
	Z	その他のもの	9/00		光学位相差の測定; コヒ - レンス度の決定; 光学的波長の測定 (分光測定 G01J3/00) [3]
5/12		.. 熱電素子によるもの, 例 . 熱電対			・干渉法によるもの [3]
5/14		... 電氣的特徴	9/02		・同一光源ではあるが異った周波数の 2 つの波のうなりおよび得られた低周波の位相の測定によるもの [3]
5/16	 冷接点についての構成; 周囲温度または他の変化の影響の補償	9/04		個々の光パルスまたは光パルス列の特性の測定 [5]
5/18	 指示または記録のための特別な適用			
5/20		.. 放射線に感ずる抵抗, サ - ミスタまたは半導体によるもの	11/00		
	B	ボロメ - タによるもの			
	D	・接合を有するボロメ - タ			
	Z	その他のもの			
5/22		... 電氣的特徴			
5/24	 特に適用された回路, 例 . ブリッジ回路, の使用			
5/26	 指示または記録のための特別な適用			
5/28		.. 光電子放射セル, 光電導セル, または光起電力セルによるもの			
5/30		... 電氣的特徴			
5/32	 指示または記録のための特別な応用			
5/34		.. コンデンサ - によるもの			
	A	焦電型検出器によるもの			
	S	・信号処理			
	C	電気容量変化型			
	Z	その他のもの			
5/36		.. ガスの電離によるもの			
5/38		・固体または流体の伸長または膨張			
5/40		.. バイメタル素子によるもの			
5/42		.. ゴレイセルによるもの			
5/44		.. 共振周波数の変化によるもの, 例 . 圧電結晶の			
5/46		・放射圧またはラジオメ - タの効果によるもの			
5/48		・全体的視覚手段によるもの			
	A	サ - モグラフィに係るもの			
	C	指定部分の温度表示・比較手段を用いるもの			
	D	イメ - ジセンサ等を用いるもの			
	E	補正手段を用いるもの			
	F	光学系・構造的なもの			
	G	非電氣的な検出器, 例 . 液晶サ - モグラフィ			
	Z	その他のもの			
5/50		・以下のサブグル - プに関する特別な技術によるもの			
5/52		.. 参照値との比較によるもの, 例 . 繊維条消失型高温計			
5/54		... 光学的特徴			
5/56		... 電氣的特徴			
5/58		.. 吸収によるもの; 偏光によるもの; 減光効果によるもの			
5/60		.. 色温度の測定によるもの			
	A	光学系・電気回路の結合に係るもの			
	C	電気回路に係るもの			
	D	光学系・構造的なもの			

